



<b>ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b> при температуре (25 ± 5)° C							
Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а					
		574УД1АСВК		574УД1БСВК		574УД1ВСВК	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Максимальное выходное напряжение, В	U <sub>о max</sub>	10	-10	10	-10	10	-10
Напряжение смещения нуля, мВ	U <sub>ю</sub>	-50	50	-25	25	-50	50
Входной ток, нА	I <sub>п</sub>	-0,5	0,5	-0,5	0,5	-1	1
Разность входных токов, нА	I <sub>ю</sub>	-0,2	0,2	-0,2	0,2	-0,5	0,5
Ток потребления, мА	I <sub>сс</sub>	-8	8	-8	8	-8	8
Коэффициент усиления напряжения	A <sub>У</sub>	5•10 <sup>4</sup>	-	5•10 <sup>4</sup>	-	5•10 <sup>4</sup>	-
Режим измерения при: U <sub>сс</sub> = ± 15,0 В; R <sub>L</sub> = 2 кОм Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем: - золото Цветных металлов не содержится.							

**НАДЕЖНОСТЬ**

Минимальная наработка (Т<sub>нм</sub>) микросхем в режимах и условиях допускаемых ТУ, - 100000 ч, а в облегченных режимах при: U<sub>сс</sub>=± 12 В; U<sub>I</sub> ≤ 7 В; R<sub>L</sub>/10 к Ом – 120000 ч.

Гамма-процентный ресурс (Т<sub>γ</sub>) микросхем при γ=95% 200000 ч

Минимальный срок сохраняемости микросхем (Т<sub>см</sub>) при их хранении:

- в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой или местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, - 25 лет;
- в неотапливаемом хранилище – 16,5 лет;
- под навесом и на открытой площадке, смонтированными в аппаратуру ( в составе незащищенного объекта), или в комплекте ЗИП – 12,5 лет.

Срок сохраняемости исчисляется с даты изготовления, указанной на микросхеме.

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых микро-схем всем требованиям АЕЯР.431130.205 ТУ в течение срока сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и эксплуатации, а также указаний по применению, установленных ТУ.

Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхеме.